

# SBS-M1

可変方式を採用した  
Logic/Analog共用バーンイン装置

## 特長 — Features —

### 多品種に対応

- ・電源構成は製品に合わせてカスタマイズ可能

### テスタープログラムをそのまま流用

- ・STILコンバータ使用

### 処理能力向上

- ・昇降時間を短縮、スキャン機能搭載
- ・キャリアラック方式

### 歩留り改善

- ・サーバーにDUTの情報を保持

### キャリアラック方式



## Specification

Target Device	Analog & Mixed signal IC / MCU & MPU		Power Supply	PS1A	0.5 ~ 34.0V /3.9A /slot*	
Dimension	1,530(D) × 2,400(W) × 2,300(H) mm			PS1B	0.5 ~ 34.0V /3.9A /slot*	
Burn-In Chamber	1chamber / 4zones / 48slots			PS2A	0.5 ~ 90.0V /4.8A /slot*	
	Temp Range	+70°C~+150°C		PS2B	0.5 ~ 50.0V /4.8A /slot*	
	Carrier rack	(1 rack/ 12 slots) x 4 racks		* It is changeable to various specifications.		
Pattern Generator	Temperature Distribution	±3 degrees C (with 5kW loading)		10.0V/12.0A/slot, 34.0V/7.0A/Slot, 50.0V/2.6A/slot,		
	Vector Memory	128MWords x 56ch		120.0V/6.6A/ZONE, 120.0V/13.0A/ZONE, etc.		
Driver	Best Test Freq	10MHz		Output Accuracy ±(0.5% of setting value +100mV)		
	Channel	56ch (FSA :28ch,FSB :28ch)		VIH1 +1.0~+18.0V /27.0A /zone		
	Output Voltage Range	VIH2=+1.0V~+18.0V VIL =0.1V and under fixed		VIH2 +1.0~+18.0V /27.0A /zone		
Comparator	Device Monitor	124 (Scan Function : 363)	Burn-In Board	450(W) × 580(L) mm		
	Max Input Voltage	24.0V		Software Function	Pretest Function Diagnostic Function	
				PSMPX 0.0 ~ 10.0A / zone for Scan function use.		